

عنوان مقاله:

اثر زمان لایه نشانی بر خواص ساختاری و مغناطیسی لایه های مس، آهن

محل انتشار:

پنجمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

فاطمه رجبعلی

سarasادات پرهیزگار

خلاصه مقاله:

در این تحقیق، دو لایه های $\text{min x(Cu)/15min(Fe)}$ با استفاده از دستگاه کندوپاش استوانه ای Magnetron DC Sputtering بر روی زیرلایه شیشه اسپاتر شدند و مورفولوژی سطح لایه ها، ساختار و خواص مغناطیسی لایه ها مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین ساختار، مورفولوژی سطح و خواص مغناطیسی از آنالیزهای پراش پرتو XRD (x)، میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و میکروسکوپ نیروی مغناطیسی (MFM) استفاده شد. مشاهده شد که با افزایش زمان لایه نشانی مس از 5 به 15 دقیقه، ضخامت و زبری افزایش یافته است، همچنین لایه در جهت بلوری [1] دارای بافتی قوی میشود و طبق نتایج آنالیز MFM مغناطش حوزه ها کاهش و اندازه های حوزه ها افزایش یافته است.

کلمات کلیدی:

کندوپاش مغناطیسی، مورفولوژی سطح، مغناطش و میکروسکوپ نیروی مغناطیسی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/655178>

